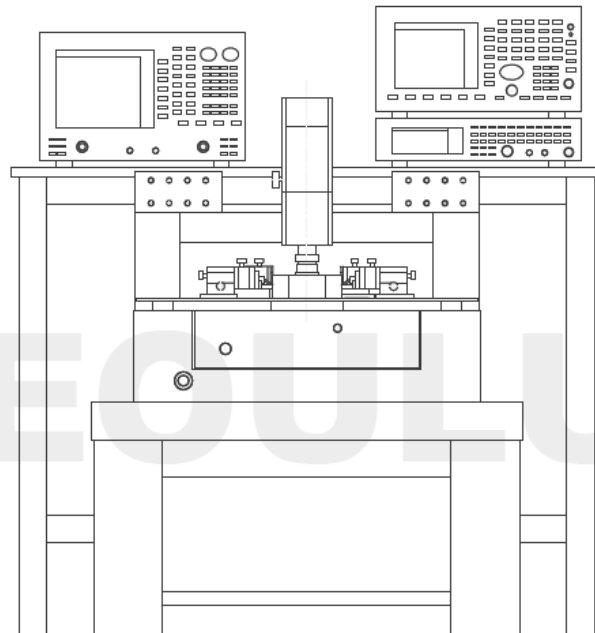




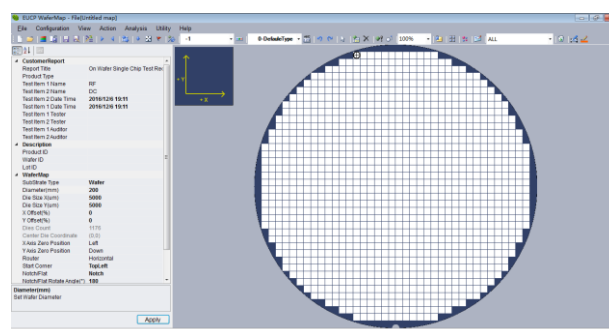
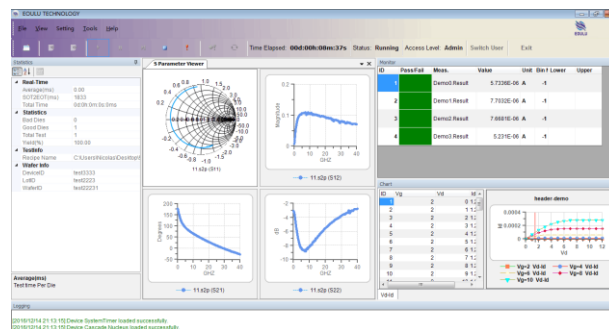
EUCP ON WAFER

EOULU™ 统一通信平台

EUCP 是晶圆在片测试操作系统 (OS)



- 高精度测试
- 高速测试
- 快速接入可编程设备
- 兼容多系统集成
- 平台与应用完全分离
- 平台独立升级
- 节约产品上市时间 (TTM)
- 安全数据存储与数据处理



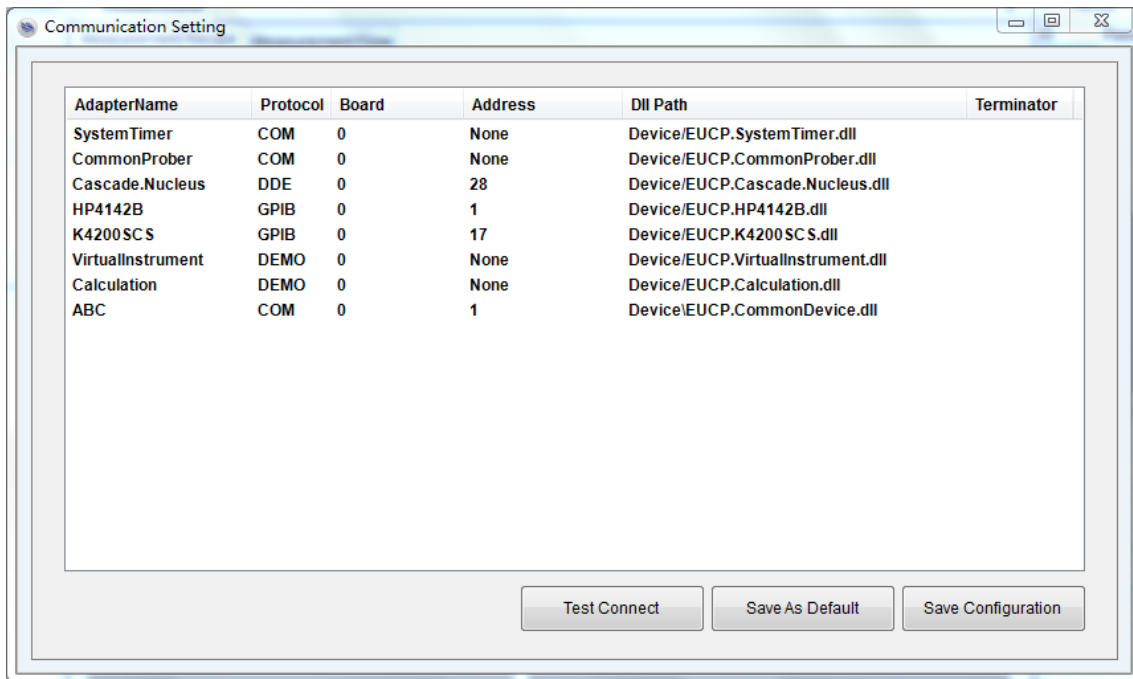
数据手册

EUCP ON WAFER 是 EOULU 自主开发的统一硬件通信平台，也是晶圆在片测试测量的操作系统。EUCP 可以很轻松的集成所有可编程控制的设备。EUCP 运用时下先进的测试虚拟机 (TVM) 技术，较少实时运行程序集的同时增强了测试稳定性。而且，EOULU 首次提出晶圆在片测试行业增强型操作系统的概念，为晶圆在片测试领域提供简单易用的强有力生产工具。

EUCP 简介

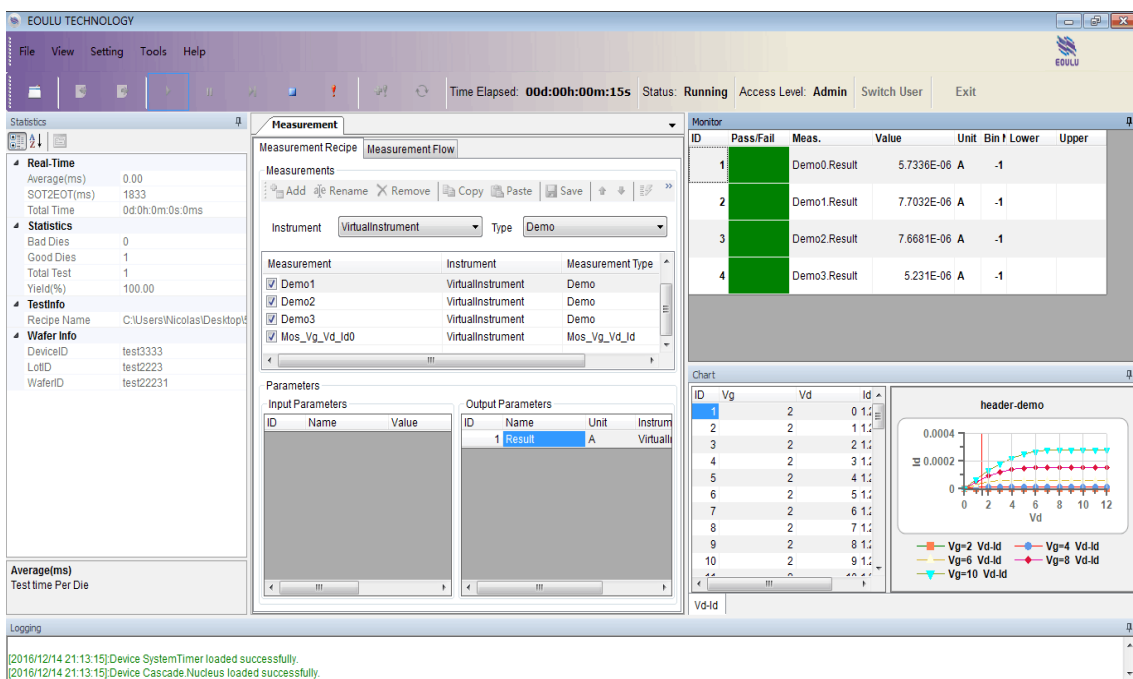
1. 配置设备

- 连接测试系统所有可编程设备，包括探针台、打点器、传感器和程控仪表
- 所有编程设备挂载容器



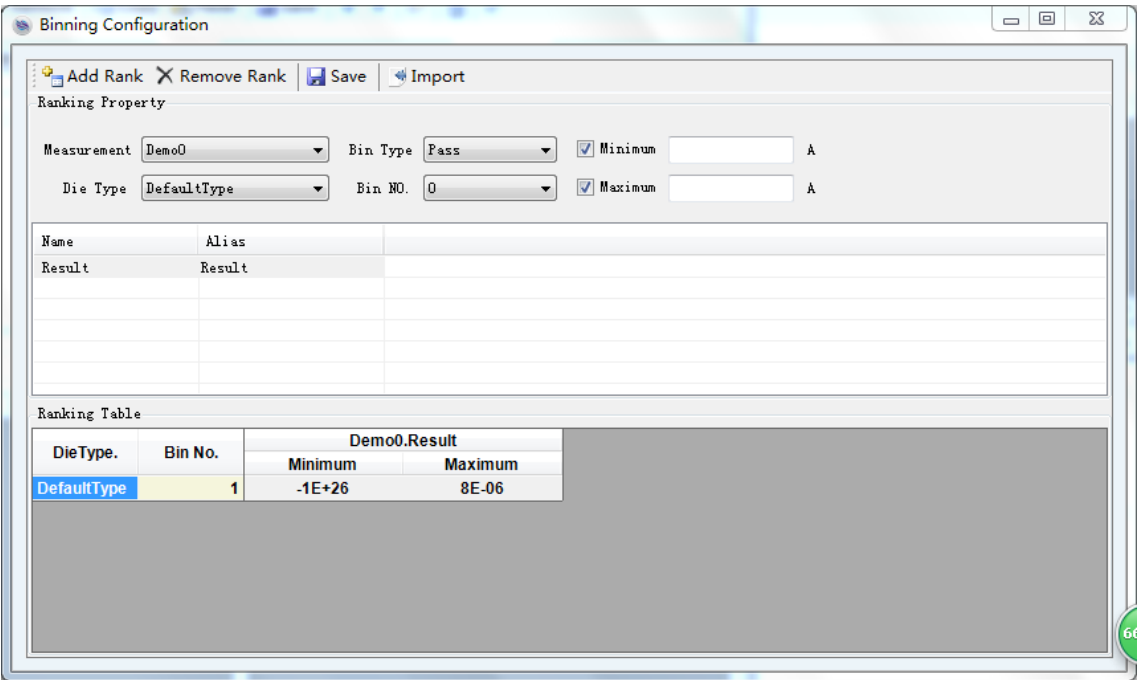
2. 输入/输出参数，以及测试菜单

- 自动列出相关设备及应用虚拟设备的输入输出参数
- 客户可自定义测试流程作为测试菜单
- 导入/导出测试菜单



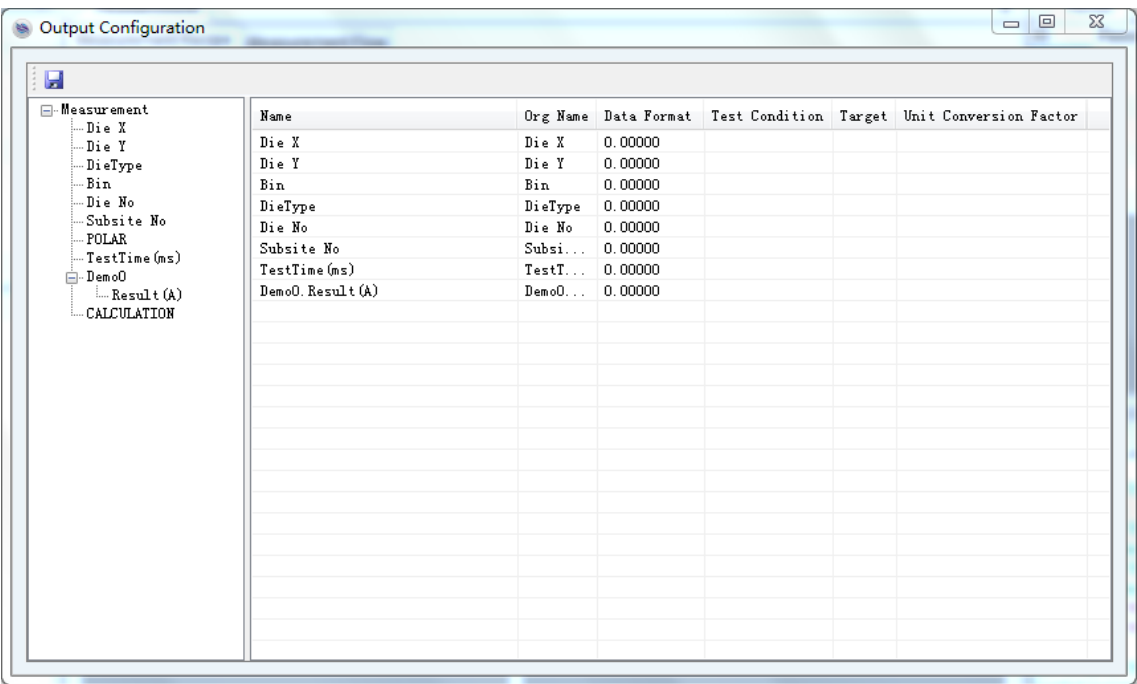
3. 测试结果分级

- 用户完全自定义分级条件
- 设置测试结果接受/拒绝接受的条件
- 最大支持 4096 个分级与色阶
- EUCP-CM 支持 BinTable 条件以 Excel 文件形式导入导出



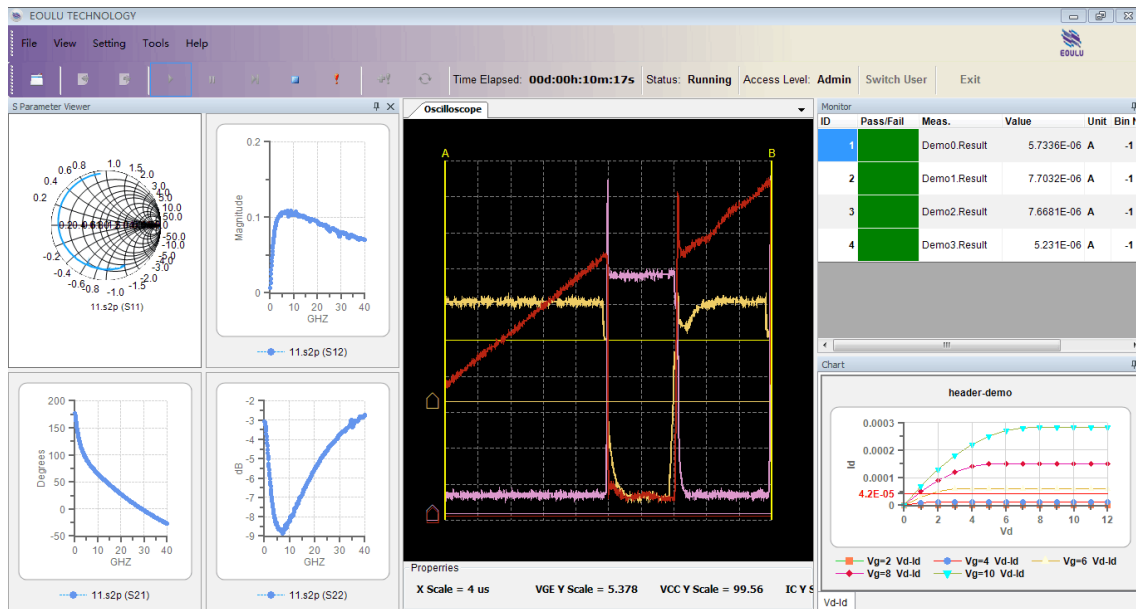
4. 输出文件内容自定义

- 用户可以自定义测试结果输出项目与顺序
- 拖拽功能使操作便捷快速



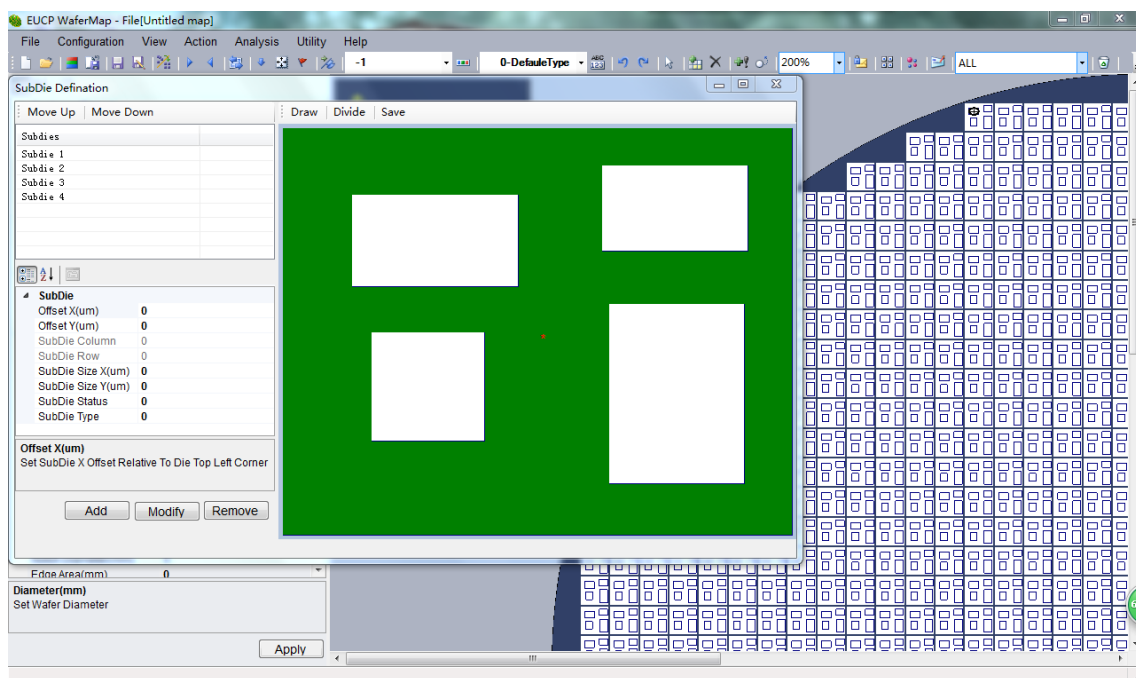
5. 控制与图像

- 单点测试测量
- 单个位置重复测试测量
- 支持碎片测量与整晶圆测量
- 各类图形化曲线显示，如二维曲线，三维曲线、射频曲线显示与示波器等
- 展示测试信息与扼要数据统计，如测试时间和成品率等



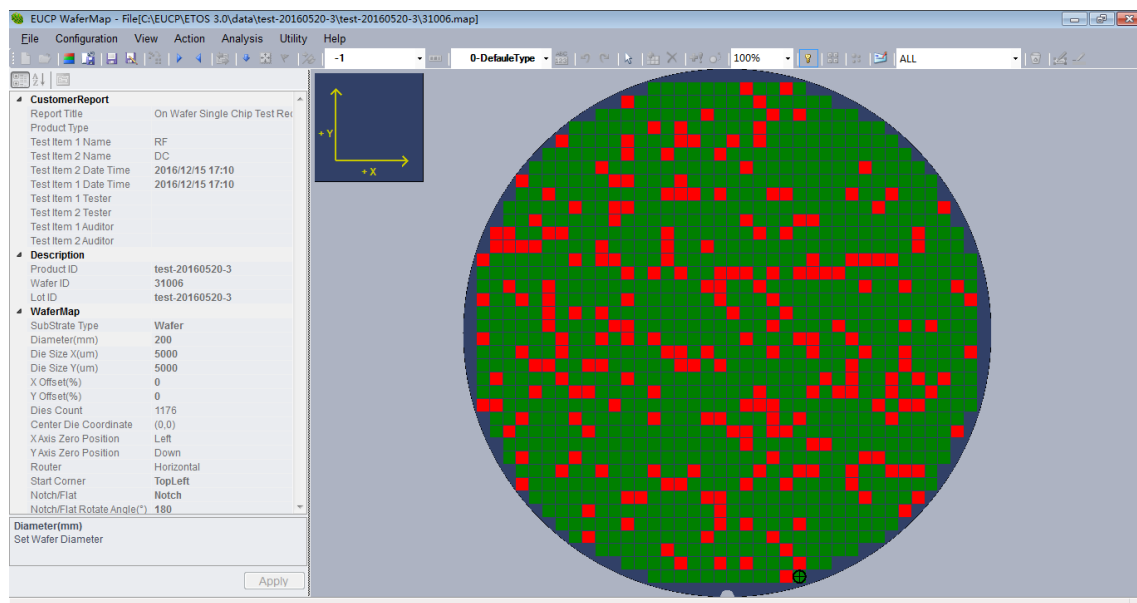
6. 晶圆地图编辑器

- 用户在传统晶圆地图编辑基础上有更直观体验
- 用户自定义 Sub Die 地图
- 具有扼要数据分析功能



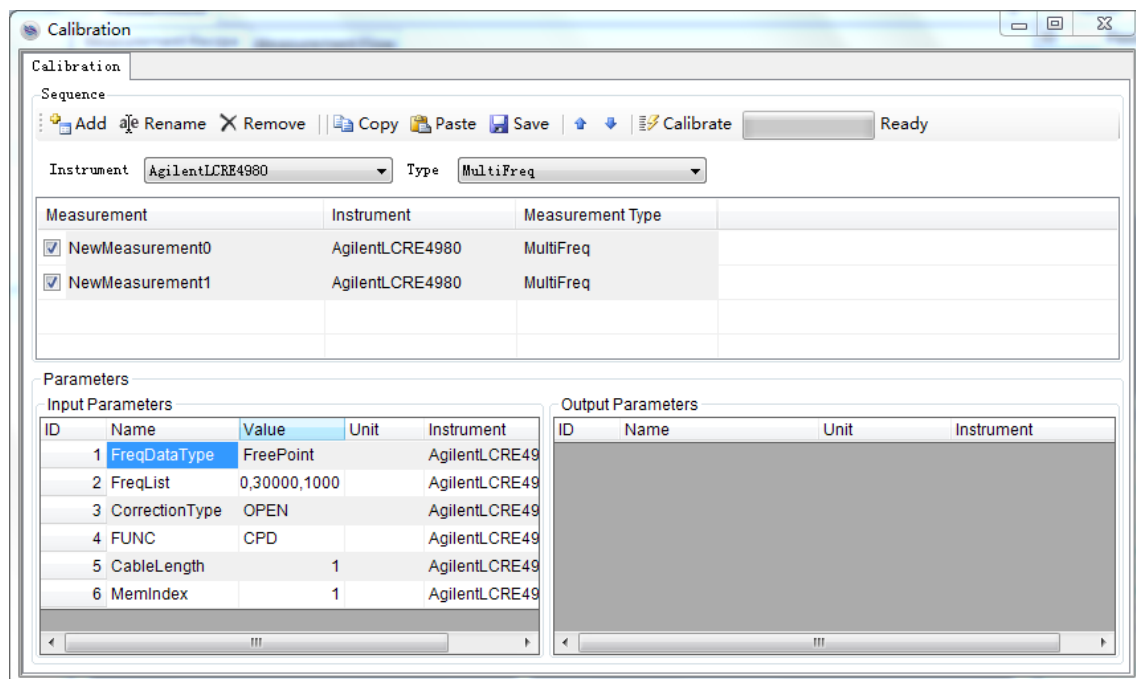
7. 晶圆测试系统

- 支持自动化晶圆测试
- 支持自定义位置测试
- 支持丰富的测试结果色阶图



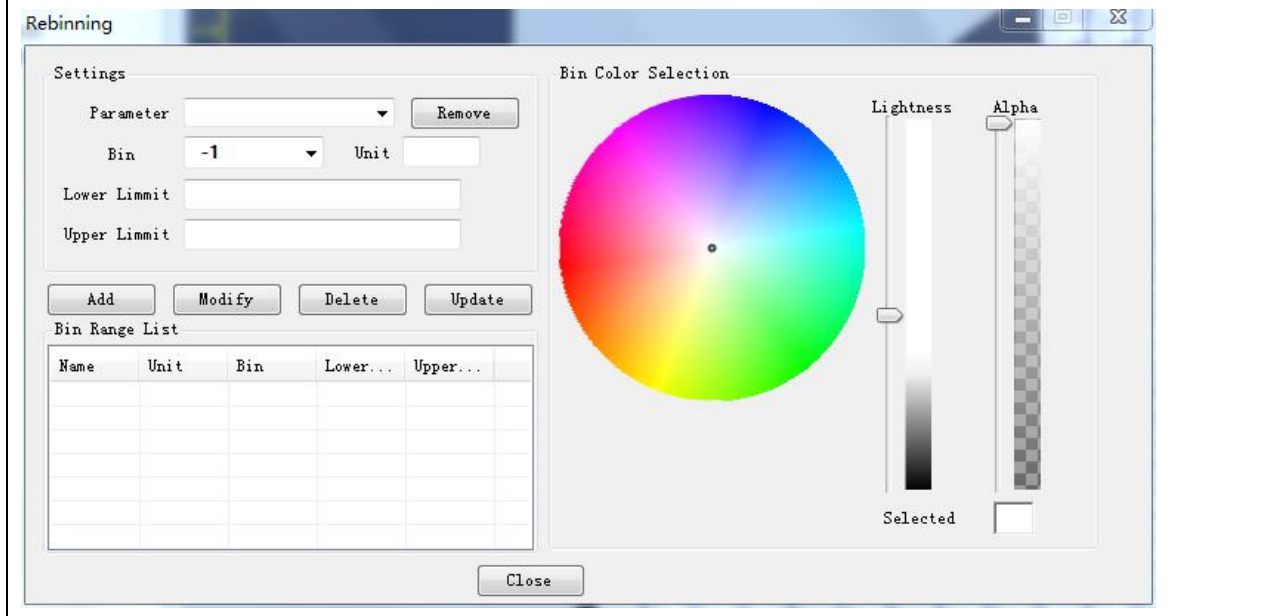
8. 直流测试校准辅助

- 支持测试通道自动校准与手动校准



9. 离线分级

- 根据测试数据及晶圆地图，用户可以重新定义数据分级条件
- 分级信息重定义数据覆盖原晶圆地图



附录一：

设备商	可编程设备类别	设备型号
Keysight(原 Agilent)	DC Power Supply	Agilent E3631 Series
		Agilent 6625A, 6626A, 6628A, and 6629A
		Agilent N6700 Series
	DC Source Meter	HP 4142B
	Dynamic Signal Analyzer	Agilent 35670
	ENA	Agilent E5071 Series
		Agilent E8362 Series
		Agilent E8363 Series
	LCR Meter	Agilent LCR E4980A
		Agilent LCR 4284A
	Lightwave Component Analyzer	Agilent N4373
	Multimeter	Agilent 34410
		Agilent 34411
		Agilent 3458A
		Agilent 34401
	Oscilloscope	Agilent 86100 Series
		Agilent 54830 Infiniium Series
		Agilent InfiniiVision 6000 Series
	PNA-X	Agilent PNA-X Series
	Semiconductor Parameter Analyzer	Agilent 4156 Series
		Agilent B1500 Series
		Agilent B1505 Series
	DAQ/Switch	Agilent 34972A
		Agilent B2201A
		Agilent 5250A
		HP 4085M
	Pulse/Data Generator	Agilent 81110A
		Agilent 81104A
	Function / Arbitrary Waveform Generator	Agilent 33500 & 33600 Series Waveform Generators
	NFA Series	Agilent N897xA

	Agilent X-Series Signal Analyzer	PXA Signal Analyzer N9030A
		MXA Signal Analyzer N9020A
		EXA Signal Analyzer N9010A
		CXA Signal Analyzer N9000A
NI	Function / Arbitrary Waveform Generator	NI 5402
	DAQ/Switch	NI 6501
		NI 6221
TEK	Semiconductor Parameter Analyzer	Keithley 4200A-SCS
	DC Source Meter	Keithley 2400 Series
		Keithley 2500 Series
		Keithley 2600 Series
	DAQ/Switch	Keithley 2700 Series
		Keithley 7001
		Keithley 700 Series
	Electrometer	Keithley 6517 Series
	Function / Arbitrary Waveform Generator	TEK AFG 1000
		TEK AFG 2000
		TEK AFG 3000
		TEK AWG 4000
	Oscilloscope	TEK MDO 3000 Series
		TEK MDO 4000 Series
R&S	VNA	ZVA Series
	Signal and Spectrum Analyzer	RSFSW Series
Anritsu	VNA	MS462XX Series
		AU37XX Series
SRS	Lock-In Amplifier	SR830,SR810
YOKOGAWA	Optical Spectrum Analyzer	AQ6370C/AQ6370D/AQ6373/
		AQ6373B/AQ6375/AQ6375B
Instrument Systems	Spectrometer	CAS 120
		CAS 140CT
Maury	Tuner	Maury Automated Tuner Series
Cascade	Prober Station	Cascade Manual Probe Station Full Series

		Cascade Semi-auto Probe Station Full Series
		Cascade Full-auto Probe Station Full Series
		Cascade High Power Probe Station Full Series
Newport	Monochromator	Oriel Cornerstone 260
	Positioning Stages	Nano PZ M562
Auriga	Pulse IV System	Auriga 4850
EOULU	Plug-in	Matlab Controller
		Third Party COM Object or System
Iwatsu	High Power Static Tester	CT3200
		CT10400
STESLA	High Power Static Tester	Full Series
DTESLA	High Power Dynamic Tester	Full Series
艾斯泰克	DC Power Supply	IT6100 Series
		IT6874
		IT8500

EOULUWebsite: www.eoulu.comEmail: Info@eoulu.com

Sales Contact:

Add.: Room 305/306, Building A7, No.218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China

P.C: 215000

Tel: +86-512-62757360

Fax: +86-512-62757313